

余弦辐射探头

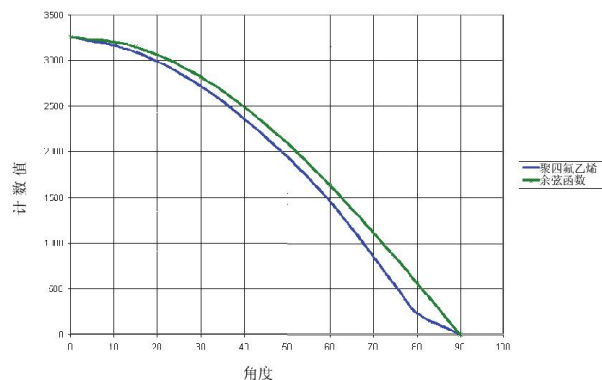
余弦辐射探头是一种用于光谱辐射取样的光学元件，用于收集 180° 立体角内的辐射（光线），从而消除了其它取样装置中光线收集装置几何结构中的光学接口问题。

对于 UV/VIS 波段（200-2500 nm），LS-CC 余弦辐射探头采用了特氟龙（聚四氟乙烯）漫射材料，而对于 UVIR 波段（190-3200 nm）莱森光学采用了气泡 SiO₂ 材料对 LS-CC 余弦辐射探头进行优化。两种余弦辐射探头都可以和任何 SMA 接头的光纤旋拧起来。当它和微型光纤光谱仪配合使用时，余弦辐射探头可以用来测量 UV-A 和 UV-B 太阳辐射、环境光、灯光和其它发光光源。

余弦辐射探头的外径为 8mm/12mm/16mm/36mm，其表面进行了氧化平滑发黑处理，非常坚固。散射材料是一个安装在壳底的薄片。余弦辐射探头有 SMA905 接头可以方便的与光纤耦合。



余弦校正器



CC-UV/VIS 角度响应曲线

主要技术参数

型号	LS-CC4-UV	LS-CC8-UV	LS-CC10-UV
漫散材料	特氟龙 (200-2500 nm) , 约 1mm 厚		
透过率	> 40%-50%		
余弦面直径	3.9mm (其它尺寸可定制)	7.5mm (其它尺寸可定制)	10mm (其它尺寸可定制)
探头直径	8mm	12mm	16mm
取样几何结构	接收来自 180°立体角的光		
接头	SMA 905		

型号	LS-CC5-UVIR	LS-CC8-UVIR	LS-CC30-UVIR
漫散材料	气泡 SiO ₂ (190-3200 nm) , 约 1mm 厚		
透过率	> 50%		
余弦面直径	5mm (其它尺寸可定制)	8mm (其它尺寸可定制)	30mm (其它尺寸可定制)
探头直径	8mm	12mm	36mm
取样几何结构	接收来自 180°立体角的光		
接头	SMA 905		